

吴斌 武汉 华中师范大学物理科学与技术学院 430079

黄致新 武汉 华中师范大学物理科学与技术学院 430079

等

王辉 武汉 华中师范大学物理科学与技术学院 430079

摘要：扫描探针显微镜是目前世界上分辨率最高的显微镜之一，也是纳米技术研究的主要工具。本文在分析原子力显微镜工作原理的基础上，探讨多模式扫描探针显微镜的相关功能，并对扫描探针显微镜的发展前景进行展望。

关键词：

文章全文为PDF格式，请下载至本机浏览。[[下载全文](#)]

如您没有PDF阅读器，请先下载PDF阅读器 [Acrobat Reader](#) [[下载阅读器](#)]

[Discussion of multimode scanning probe microscope based on AFM](#)

430079

430079

430079

Abstract: Scanning probe microscope can reach atomic resolution, and it is important for nano technology. Based on the discussion of the principle of atomic force microscope, the function of multimode scanning probe microscope has been investigated. And the developing prospects of the scanning probe microscope have been stated at last.

Key words:

[【大 中 小】](#) [[关闭窗口](#)]